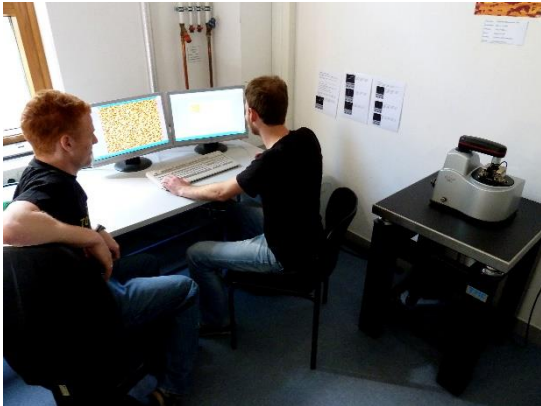


AFM

Atomic Force Microscope, Rasterkraftmikroskop

Das AFM ist ein hochauflösendes analytisches Messgerät, das zur Visualisierung der Oberflächenstrukturen eingesetzt wird. Mit Hilfe eines AFMs können Oberflächentopographien in mikro- und nanoskaligen Dimensionen sichtbar gemacht werden.



Diese Technik wird in vielen Bereichen zur Strukturaufklärung von Oberflächen genutzt und gewinnt nicht nur in der Nanotechnologie, sondern auch in der medizinischen Biologie zunehmend an Bedeutung.



Der Vorteil des AFMs ist, dass die Proben im Vergleich zu anderen Methoden (z.B. Rastertunnelmikroskopie) keine besonderen Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit aufweisen müssen. Daher ist diese Messmethode besonders für biologische Proben interessant.